Circuit substrate including insulating layer of aluminum nitride and electrically conductive layer of conductive component, aluminum nitride and other components, and semiconductor device containing same

Patent Number: ☐ US5616956 Publication date: 1997-04-01

HORIGUCHI AKIHIRO (JP); MONMA JUN (JP); KIMURA KAZUO (JP); OH-ISHI Inventor(s):

KATSUYOSHI (JP); UENO FUMIO (JP); KASORI MITSUO (JP); SUMINO HIROYASU

Applicant(s):

Requested

Patent:

☐ JP8081265 Application

Number:

US19950524906 19950907

Priority Number

(s):

JP19940221327 19940916

**IPC** 

Classification:

H01L23/02; H01L23/48; H01L29/62; C04B35/58

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP)

EC

Classification:

H01L25/16, C04B35/581

Equivalents:

#### Abstract

Disclosed is a circuit substrate and a semiconductor device to which the circuit substrate is applied. The circuit substrate has an insulating layer and an electrically conductive layer. The insulating layer is composed of a sintered aluminum nitride composition containing: aluminum nitride; a first component given by a compound containing an element which is selected from the group consisting of group Ila elements and group Illa elements of the periodic table; a second component given by either a simple boron or a boron compound; and a third component give by either a simple manganese or a manganese compound. The electrically conductive layer contains: a conductive component given by a metal or an electrically conductive compound for exhibiting electric conductivity; aluminum nitride; the first component; the second component; and the third component. The semiconductor device has the above circuit substrate, a semiconductor element mounted on the circuit substrate, and a cap being tightly bonded to the circuit substrate with a sealing glass to cover the semiconductor element.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=US5616956&PN...

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# 文南大1

# 特開平8-81265

(43)公開日 平成8年(1996)3月26日

(51)Int.Cl. <sup>4</sup>	F I 技術表示箇所
41/87 C	
41/88 Q	•
	C 0 4 B 35/58 1 0 4 F
	104 B
審査請求	未請求 蘭求項の数 6 OL (全 26 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号 特願平6-221327	(71) 出願人 000003078
	株式会社東芝
(22)出願日 平成6年(1994)9月16日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
	(72)発明者 堀口 昭宏
	神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
	式会社東芝研究開発センター内
	(72)発明者 門馬 旬
,	神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目4番地 株式会社東芝京浜事業所内
	(72)発明者 木村 和生
	神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目4番地
	株式会社東芝京浜事業所内
	(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 室化アルミニウム焼結体、窒化アルミニウム焼結体の製造方法、回路基板および回路基板の製造 方法

### (57)【要約】

【目的】 緻密で良好な熱伝導性を有し、かつガラス封 止性が良好な窒化アルミニウム焼結体を提供しようとす るものである。

【構成】 窒化アルミニウムを主成分とし、かつIIa族元素およびIII a族元素から選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物換算で0.005~4重量%含有することを特徴とするものである。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化アルミニウムを主成分とし、かつII a族元素およびIIIa族元素から選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物(B,O,)換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物(MnO,)換算で0.005~4重量%含有することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体。

【請求項2】 (a) 窒化アルミニウム粉末と(b) 前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と(c)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(B,O,)換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(MnO,)換算で0.01~5重量%配合されるマンガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を焼結することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体の製造方法。

【請求項3】 窒化アルミニウムを主成分とし、かつII 20 a 族元素およびIII a 族元素から選ばれる少なくとも 1 種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物(B,O,)換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物(MnO,)換算で0.005~4重量%含有する絶縁層と、

少なくとも一部が金属単体および/または導電性化合物、窒化アルミニウム、硼素もしくは硼素化合物およびマンガンもしくはマンガン化合物を含有し、かつIIa族元素-Al-O系化合物、IIIa族元素-Al-O系化合物およびIIa族元素-IIIa族元素-Al-O系化合物から選ばれる少なくとも一つの化合物を含有する導体層とを具備したことを特徴とする回路基板。

【請求項4】 (a)窒化アルミニウム粉末と(b)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と

(c)前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物(B,O,)換算で $0.01\sim5$ 重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(MnO,)換算で $0.01\sim5$ 重量%配合されるマンガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を成形してグリーンシートを作製する工程と、

(A)金属単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニウム粉末と(C)IIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも I種と(D)硼素もしくは硼素化合物(E)およびマンガンもしくはマンガン化合物とを含む導体ペーストを調製する工程と、

前記グリーンシートの少なくとも表面に前記導体ペース 50 する回路基板が注目されている。

トをパターン状に塗布した後、積層、脱パインダ、焼結 を行う工程とを具備したことを特徴とする回路基板の製 造方法。

【請求項5】 (a) 窒化アルミニウム粉末と(b) 前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c) 前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物および(d) 前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物を含む原料を焼結することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体の製造方法。

【請求項6】 (a) 窒化アルミニウム粉末と(b) 前 記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c) 前 記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される研索もしくは硼素化合物と(d) 前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含む原料を成形してグリーンシートを作製する工程と、

(A)金属単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニウム粉末と(C) IIa族元素化合物およびII I a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種と(D) 硼素もしくは硼素化合物と(E) アルミナもしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含む導体ペーストを調製する工程と、

前記グリーンシートの少なくとも表面に前記導体ベーストをパターン状に塗布した後、積層、脱バインダ、焼結を行う工程とを具備したことを特徴とする回路基板の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、窒化アルミニウム(A IN)焼結体、AIN焼結体の製造方法、回路基板およびその製造方法に関し、さらに詳しくは、緻密で、熱伝導性が良好なAIN焼結体、低温焼結が可能なAIN焼結体の製造方法、ガラス封止性が良好な回路基板およびその製造方法に係わる。

[0002]

【従来の技術】電子機器においては、IC、LSI等の電子デバイスの実装、回路形成、および絶縁を目的としてアルミナを基材とする回路基板が使用されている。しかしながら、前記アルミナ基材は熱伝導率が約20W/m・Kと低いため、近年のLSIの高密度化、高集積化に対応して高熱伝導性のAIN焼結体からなる基材を有する回路基板が注目されている。

【0003】ところで、AINは共有結合性が強く、難 焼結材料であるため緻密な焼結体を得るためには、最低 1800°Cの焼結温度が必須であった。

【0004】 このようなことから、特開昭61-117 160号公報にはA1N粉末に希土類元素化合物および アルカリ土類酸化物を同時に添加した原料を用いること により低温焼結化を図る方法が開示されている。しかし ながら、前記焼結温度はせいぜい1700℃以上であ り、1600℃程度もしくはそれ以下の焼結温度では緻 密化は達成されず、また焼結体中にシミ等が発生しやす いという問題点があった。また、回路基板を半導体素子 のパッケージに応用する際、前記回路基板のAIN焼結 体からなる基材にキャップをガラス封止する工程におい ても、前記A1N焼結体はガラス封止に有効な効果をも たらす成分が含有されていないために、封止性が劣ると いう問題があった。

【0005】また、特開昭62-153173号公報に はA1N粉末にIVa族元素、Va族元素、VIa族元素、 VII a族元素およびVIII族元素から選ばれる少なくとも 1種を添加した原料を用いることによりA1N焼結体の 20 高密度化、高熱伝導率化を図ることが開示されている。 しかしながら、この発明においても焼結温度の低温化は 不十分であり、ガラス封止が良好になる成分の添加が欠 如している。

【0006】一方、特開昭62-153173号公報や 特開平4-130064号公報には原料中にマンガンを 添加することが記載されているが、いずれも着色や透過 性を改善するためであり、焼結温度の低温化は期待でき ないか、もしくは不十分である。さらに、ガラス封止に 関しての特性の向上は望めない。

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、緻密 で良好な熱伝導性を有し、かつガラス封止性が良好なA 1 N焼結体を提供しようとするものである。

【0008】本発明の別の目的は、1400℃~170 0℃前後の低温の焼結で緻密化して良好な熱伝導性を有 し、かつガラス封止性が良好なAIN焼結体の製造方法 を提供しようとするものである。

【0009】本発明のさらに別の目的は、緻密で良好な 熱伝導性を有し、かつガラス封止性が良好なA1N焼結 40 体からなる絶縁層と、前記絶縁層に対して良好に密着し た導体層とを備えた回路基板およびその製造方法を提供 とするものである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明によると、A1N を主成分とし、かつIIa族元素およびIII a族元素から 選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05 ~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を 酸化物 (B, O, ) 換算で0.01~4重量%、マンガ ンもしくはマンガン化合物を酸化物(MnO.)換算で 50 合される硼素もしくは硼素化合物および(d)前記A!

0. 005~4 重量%含有することを特徴とするAIN 焼結体が提供される。

【0011】本発明によると、(a) A1N粉末と

- (b) 前記A1N粉末に対して酸化物換算で0.05~ 15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族 元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と
- (c)前記A1N粉末に対して酸化物(B,O,)換算 で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合 物と(d)前記AlN粉末に対して酸化物(MnO。) 換算で0.01~5重量%配合されるマンガンもしくは マンガン化合物とを含む原料を焼結することを特徴とす るAlN焼結体の製造方法が提供される。

【0012】本発明によると、AINを主成分とし、か つIIa族元素およびIII a族元素から選ばれる少なくと も1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有 し、さらに砌素もしくは硼素化合物を酸化物(B

2 O 2 ) 換算で O . O 1 ~ 4 重量%、マンガンもしくは マンガン化合物を酸化物(MnO,)換算で0.005 ~4 重量%含有する絶縁層と、少なくとも一部が金属単 体および/または導電性化合物、AIN、硼素もしくは 硼素化合物およびマンガンもしくはマンガン化合物を含 有し、かつIIa族元素-Al-O系化合物、III a族元 素-A!-O系化合物およびIIa族元素-IIIa族元素 -A1-O系化合物から選ばれる少なくとも一つの化合 物を含有する導体層とを具備したことを特徴とする回路 基板が提供される。

【0013】本発明によると、(a) A1N粉末と

(b)前記A1N粉末に対して酸化物換算で0.05~ 15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族 30 元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と

(c)前記A1N粉末に対して酸化物(B,O,)換算 で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合 物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物 (MnO, ) 換算で0.01~5重量%配合されるマン ガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を成形してグ リーンシートを作製する工程と、(A)金属単体および /または導電性化合物と(B) AlN粉末と(C) IIa 族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少 なくとも1種と(D)硼素もしくは硼素化合物(E)お よびマンガンもしくはマンガン化合物とを含む導体ペー ストを調製する工程と、前記グリーンシートの少なくと も表面に前記導体ペーストをパターン状に塗布した後、 積層、脱バインダ、焼結を行う工程とを具備したことを 特徴とする回路基板の製造方法が提供される。

【0014】本発明によると、(a) A I N粉末と

(b)前記A1N粉末に対して酸化物換算で0.05~ 15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元 素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c)前記 A1N粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配

N粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物を含む原料を焼結することを特徴とするA1N焼結体の製造方法が提供される。

【0015】本発明によると、(a) Al N粉末と

(b)前記A1N粉末に対して酸化物換算で0.05~ 15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元 素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c)前記 A 1 N粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配 合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記A1N粉 10 末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される アルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミ ニウム化合物とを含む原料を成形してグリーンシートを 作製する工程と、(A)金属単体および/または導電性 化合物と(B)AIN粉末と(C)IIa族元素化合物お よびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種と (D) 硼素もしくは硼素化合物と(E) アルミナもしく は焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含 む導体ペーストを調製する工程と、前記グリーンシート の少なくとも表面に前記導体ペーストをパターン状に塗 20 布した後、積層、脱バインダ、焼結を行う工程とを具備 したことを特徴とする回路基板の製造方法が提供され

【0016】以下、本発明に係わる(1) A1N焼結体、(2) この焼結体の製造方法、(3) 回路基板、

(4) との回路基板の製造方法、(5) A I N焼結体の 製造方法および(6) 回路基板の製造方法を詳細に説明 する。

#### 【0017】(1) A1N焼結体

このAIN焼結体は、AINを主成分とし、かつIIa族 30 元素およびIII a族元素から選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物換算で0.005~4重量%含有することを特徴とするものである。

【0018】前記IIa族元素としては、Ca. Ba. Sr等を挙げることができる。前記III a族元素として、Sc. Yを含む希土類元素を挙げることができる。

【0019】前記IIa族元素および前記III a族元素か 40 ら選ばれる少なくとも1種の元素の含有量を規定したのは、次のような理由によるものである。前記元素の含有量を酸化物換算で0.05重量%未満にすると、緻密で熱伝導率の高いA1N焼結体が得られなくなる。一方、前記元素の含有量が酸化物換算で15重量%を越えるとA1N焼結体の粒界相の成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下する。より好ましい前記元素の含有量は、酸化物換算で0.1~10重量%である。さらに好ましくい前記元素の含有量は、酸化物換算で0.5~8重量%である。

【0020】前記砌素化合物としては、例えば酸化砌 素、硼酸、硼化チタン、硼化タングステン、硼化ジルコ ニウムのような遷移金属硼化物、硼化ランタンのように

希土類硼化物、硼化カルシウムのようなアルカリ土類硼 化物等を挙げることができる。

【0021】前記硼素または硼素化合物の含有量を規定したのは、次のような理由によるものである。前記硼素または硼素化合物を酸化物換算で0.01重量%未満すると緻密でガラス封止性の優れたA1N焼結体を得ることができなくなる。一方、前記硼素または硼素化合物が酸化物換算で4重量%を越えるとA1N焼結体の粒界相の成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下するばかりか、表面が荒れて平坦性が損なわれる。より好ましい前記硼素または硼素化合物の含有量は、酸化物換算で0.02~3重量%である。

【 0 0 2 2 】前記マンガン化合物としては、例えば酸化マンガン(M n O、M n O。)、過マンガン酸カリウム等を挙げることができる。

【0023】前記マンガンまたはマンガン化合物の含有量を規定したのは、次のような理由によるものである。前記マンガンまたはマンガン化合物を酸化物換算で0.005重量%未満すると緻密でガラス封止性の優れたA1N焼結体を得ることができなくなる。一方、前記マンガンまたはマンガン化合物が酸化物換算で4重量%を越えるとA1N焼結体の粒界相の成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下するばかりか、表面が荒れて平坦性が損なわれる。より好ましい前記マンガンまたはマンガン化合物の含有量は、酸化物換算で0.008~2重量%である。

10024】なお、本発明に係わるAlN焼結体は、必要に応じて着色化、高強度化のためにTi,W,Mo,Ta,Nb,Mn等の遷移金属またはこれら金属の酸化物、炭化物、窒化物、硼化物をAlNに対して遷移金属換算で0.05~1重量%の範囲で含有することを許容する。また、機械的強度を向上させるために酸化珪素(SiO,)、窒化珪素(Si,N,)等の珪素化合物をAlNに対して1重量%以下の範囲で含有することを許容する。

【0025】(2)A1N焼結体の製造方法

)まず、(a)AIN粉末と(b)前記AIN粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と(c)前記AIN粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記AIN粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるマンガンもしくはマンガン化合物とをボールミル等を用いて混合して原料を調製する。

【0026】前記(a)成分のA1N粉末は、平均一次 50 粒径が0.03~1.2 μmであることが好ましい。こ

れは、次のような理由によるものである。AIN粉末の 平均一次粒径を0.03μm未満にすると粉末の取り扱 いが困難になり、かつ粉末の成形も困難になる恐れがあ る。一方、A 1 N粉末の平均一次粒径が1. 2 μ mを越 えると1700℃以下、特に1600℃以下での低温焼 結が困難になる恐れがあり、また焼結後の粒径が2μπ を越えて機械的強度が低下する恐れがある。より好まし いA 1 N粉末の平均一次粒径は、0.05~1.0μm である。

【0027】前記(a)成分のAIN粉末は、不純物酸 10 素量が0、2~3、5重量%であることが好ましい。と こで、不純物酸素量とは焼結直前の実効的に焼結に関与 する量を意味するものである。前記不純物酸素量を前記 範囲に規定したのは、次のような理由によるものであ る。不純物酸素量を0.2重量%未満にすると、170 0℃以下、特に1600℃以下での焼結が困難になった り、焼結前の混合や成形の取扱い段階でAIN粉末が酸 化等により変質したりする恐れがある。一方、不純物酸 素量が3.5重量%を越えると熱伝導率の高いA1N焼 結体を得ることが困難になる。より好ましい不純物酸素 20 量は、0.5~2重量%である。

【0028】前記(b)成分のIIa族元素化合物として は、例えばCa、Ba、Sr等の酸化物、炭化物、シュ ウ酸塩、硝酸塩、アルコキシド等を挙げることができ る。前記III a族元素化合物としては、例えばSc. Y を含む希土類元素の酸化物、炭化物、シュウ酸塩、硝酸 塩、アルコキシド、ハロゲン化物、窒化物等を挙げると とができる。これらの化合物は、1種または2種以上の 混合物の形態で使用することができる。

【0029】前記(b)成分の配合量を規定したのは次 30 のような理由によるものである。前記(b)成分を酸化 物換算で0.05重量%未満にすると、低温(1700 ℃以下)の焼結により緻密で熱伝導率の高いAIN焼結 体が得られなくなる。一方、前記(b)成分の配合量が 酸化物換算で15重量%を越えると得られたAIN焼結 体の粒界相の成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下す る。より好ましい前記(b)成分の配合量は、酸化物換 算で0.1~10重量%である。

【0030】前記(c)成分の硼素化合物としては、例 えば酸化硼素、硼酸、硼化チタン、硼化タングステン、 砌化ジルコニウムのような遷移金属硼化物、硼化ランタ ンのように希土類硼化物、硼化カルシウムのようなアル カリ土類硼化物等を挙げることができる。

【0031】前記(c)成分の配合量を規定したのは、 次のような理由によるものである。前記(c)成分を酸 化物換算で0.01重量%未満すると、低温(1700 \*C以下) の焼結により緻密で熱伝導率の高く、かつガラ ス封止性の優れたAIN焼結体を得ることができなくな る。一方、前記(c)成分が酸化物換算で4重量%を越

過ぎて、熱伝導率が低下するばかりか、表面が荒れて平 坦性が損なわれる。より好ましい前記(c)成分の配合 量は、酸化物換算で0.02~3重量%である。

【0032】前記(d)成分のマンガン化合物として は、例えば酸化マンガン(MnO、MnO、)、過マン ガン酸カリウム等を挙げることができる。

【0033】前記(d)成分の配合量を規定したのは、 次のような理由によるものである。前記(d)成分を酸 化物換算で0.005重量%未満すると低温(1700 <sup>\*</sup>C以下)の焼結により緻密でガラス封止性の優れたA 1 N焼結体を得ることができなくなる。一方、前記(d) 成分が酸化物換算で4重量%を越えるとAIN焼結体の 粒界相の成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下するば かりか、表面が荒れて平坦性が損なわれる。より好まし い前記(d)成分の配合量は、酸化物換算で0.008 ~2重量%である。

【0034】前記(b)~(d)の成分は、いずれも平 均粒径が5μm以下、より好ましくは4μm以下である ことが望ましい。

【0035】前記原料中には、前記平均粒径(0.03 ~1.2 µm)より大きい粒径を有するA 1 N粉末が含 有されることを許容する。また、前記原料中には必要に 応じて着色化、高強度化のためにTi, W, Mo, T a, Nb, Mn等の遷移金属またはこれら金属の酸化 物、炭化物、フッ化物、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸塩、 窒化物、硼化物を前記AlN粉末に対して遷移金属換算 で0.05~1重量%の範囲で配合してもよい。さら に、焼結温度の低減化に有効なA1、O,、A1F,等 のアルミニウム化合物、リンの化合物や機械的強度を向 上させるための酸化珪素(SiO,)、窒化珪素(Si , N. )等の珪素化合物をA1N粉末に対して1重量% 以下の範囲で配合することを許容する。

【0036】次いで、前記原料にバインダーを加え、混 練、造粒、整粒を行った後、成形した成形体を作製す る。この成形法としては、例えば金型プレス、冷間静水 圧プレスまたはシート成形などを採用することができ る。つづいて、前記成形体を窒素ガス気流中などの非酸 化性雰囲気中や水蒸気を含む不活性雰囲気中、空気中で 加熱して前記パインダを除去した後、非酸化性雰囲気 40 中、1400~1700℃、好ましくは1500~16 50℃の温度で焼結することによりA1N焼結体を製造 する.

【0037】一方、前記常圧焼結に代えて前記原料をホ ットプレス、熱間静水圧プレスすることによりA1N焼 結体が製造される。

【0038】(3)回路基板

この回路基板は、AINを主成分とし、かつIIa 族元素 およびIII a族元素から選ばれる少なくとも1種の元素 を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼 えると得られたAIN焼結体の粒界相の成分が多くなり 50 素もしくは硼素化合物を酸化物換算で0.01〜4重量

%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物換算で 0.005~4重量%含有する絶縁層と、金属単体およ び/または導電性化合物、AIN、硼素もしくは硼素化 合物およびマンガンもしくはマンガン化合物を含有し、 かつIIa族元素-AI-O系化合物、III a族元素-A 1-O系化合物およびIIa族元素-III a族元素-A1 - 〇系化合物から選ばれるすくなくとも1つの化合物を 含有する導体層とを具備したことを特徴とするものであ る。

【0039】前記絶縁層において、IIa族元素およびII 10 I a 族元素、硼素化合物およびマンガン化合物は前述し たAIN焼結体(1)で説明したのと同様なものが用い られ、かつこれら成分の含有量を規定したのも前述した AlN焼結体(1)で説明したのと同様な理由によるも のである。

【0040】前記導体層に含まれる金属単体、導電性化 合物としては、例えばタングステン、タングステン硼化 物、タングステン炭化物、ケイ化タングステン、モリブ デン、モリブデン硼化物、モリブデン炭化物、ケイ化モ リブデン等を挙げることができる。これらの金属単体、 導電性化合物は、導体層中に75~99重量%含有する ことが好ましい。より好ましい金属単体、導電性化合物 の含有量は80~99重量%である。

【0041】前記導体層中に含まれるAINの量は、前 記絶縁層との熱収縮性を整合させるために1~20重量 %にすることが好ましい。

【0042】前記導体層中に含まれる硼素もしくは硼素 化合物の量は、0.001~0.2重量%にすることが 好ましい。

【0043】前記導体層中に含まれるマンガンもしくは 30 マンガン化合物の量は、0.001~0.2重量%にす ることが好ましい。

【0044】(4)回路基板の製造方法

まず、(a)AIN粉末と(b)前記AIN粉末に対し て酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族 元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少な くとも1種の化合物と(c)前記A1N粉末に対して酸 化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは 硼素化合物と(d)前記A1N粉末に対して酸化物換算 で0.01~5重量%配合されるマンガンもしくはマン ガン化合物とを含む原料を有機バインダと共に有機溶剤 中に分散してスラリーを調製する。つづいて、このスラ リーをドクターブレード法により成形してグリーンシー トを作製する。

【0045】前記(a)成分のAIN粉末は、前述した A1N焼結体の製造方法(3)で説明したのと同様なも のが用いられる。

【0046】前記(b)~(d)の成分に用いられる化 合物等は、前述したA1N焼結体の製造方法(2)で説 明したのと同様なものが用いられ、かつ(b)~(d) 50 まず、(a)AIN粉末と(b)前記AIN粉末に対し

の成分の配合量を規定したのも前述したAIN焼結体の 製造方法(3)で説明したのと同様な理由によるもので

10

【0047】また、(A)金属単体および/または導電 性化合物と(B) Al N粉末と(C) IIa 族元素化合物 およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種 と(D) 硼素もしくは硼素化合物と(E) マンガンもし くはマンガン化合物とを有機パインダと共に有機溶剤中 に分散して導体ペーストを調製する。

【0048】前記(A)成分の金属単体、導電性化合物 としては、例えばタングステン、タングステン硼化物、 タングステン炭化物、ケイ化タングステン、モリブデ ン、モリブデン硼化物、モリブデン炭化物、ケイ化モリ ブデン等を挙げることができる。これらの金属単体、導 電性化合物は、後述する同時焼結工程で形成される導体 層中に75~99重量%含有されるように配合すること が好ましい。より好ましい金属単体、導電性化合物の配 合量は80~99重量%である。

【0049】前記(B)成分のAIN粉末は、後述する 20 同時焼結工程で形成される導体層中に1~20重量%含 有されるように配合することが好ましい。

【0050】前記(C)成分のIIa族元素化合物とIII a族元素化合物は、後述する同時焼結工程で形成される 導体層中に酸化物換算で0.001~3重量%含有され るように配合することが好ましい。

【0051】前記(D)成分の硼素もしくは硼素化合物 は、後述する同時焼結工程で形成される導体層中に酸化 物換算で0.001~0.2重量%含有されるように配 合することが好ましい。

【0052】次いで、前記グリーンシートの少なくとも 表面に前記導体ペーストをスクリーン印刷法等によりバ ターン状に塗布した後、窒素等の非酸化性雰囲気中、1 400~1700℃、好ましくは1500~1650℃ の温度で焼結することにより回路基板を製造する。

【0053】なお、多層回路基板は次のような手順で製 造される。まず、前記グリーシートの所定位置に層間接 続用の複数のピアホールを開孔し、前記導体ペーストの 塗布時に前記ピアホールに前記ペーストを充填して複数 枚のグリーシートを作製する。この工程において、前記 ペーストを前記ピアホールに充填した後、圧入してもよ い。つづいて、これらグリーシートを前記ピアホールが 合致するように重ね、加熱プレスして積層体とした後、 所定の寸法に端部等をカットする。ひきつづき、この積 層体を窒素ガスなどの非酸化性雰囲気中、水蒸気を含む 雰囲気中やアルゴンなどの不活性雰囲気中で加熱してバ インダを除去した後、窒素等の非酸化性雰囲気中、14 00~1700℃、好ましくは1500~1650℃の 温度で焼結することにより多層回路基板を製造する。

【0054】(5) A1N焼結体の製造方法

て酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIIIa族元素化合物の両者と(c)前記AIN粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物および(d)前記AIN粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物をボールミル等を用いて混合して原料を調製する。

【0055】前記(a)成分のA1N粉末は、前述した A1N焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様なも 10 のが用いられる。

【0056】前記(b)成分のIIa族元素化合物、IIa 族元素化合物は、前述したAIN焼結体の製造方法

(2)で説明したのと同様なものが用いられ、かつその配合量を規定したのも前述したAIN焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様な理由によるものである。

【0057】前記(c)成分の硼素化合物は、前述した AIN焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様なも のが用いられ、かつ前記(c)成分の配合量を規定した のも前述したAIN焼結体の製造方法(2)で説明した 20 のと同様な理由によるものである。

【0058】前記(d)成分の焼結によりアルミナに変換されるアルミニウム化合物としては、例えば水酸化アルミニウム、フッ化アルミニウム、硝酸アルミニウム等を挙げることができる。

【0059】前記(d)成分の配合量を規定したのは、次のような理由によるものである。前記(d)成分を酸化物換算で0.01重量%未満すると、低温(1700℃以下)の焼結により緻密で熱伝導率の高く、かつガラス封止性の優れたAlN焼結体を得ることができなくな 30る。一方、前記(d)成分が酸化物換算で5重量%を越えると、焼結時の酸素成分が多くなり過ぎて、熱伝導率が低下する。より好ましい前記(d)成分の配合量は、酸化物換算で0.1~3重量%である。

【0060】前記(b)~(d)の成分は、いずれも平均粒径が $5\mu$ m以下、より好ましくは $4\mu$ m以下であることが望ましい。

【0061】前記原料中には、前述したA1N焼結体の 製造方法(2)で説明したの同様な各種の添加物が含有 されることを許容する。ただし、A1、O,、A1F, は前記添加物から除かれる。

【0062】次いで、前記原料にバインダーを加え、混練、造粒、整粒を行った後、成形した成形体を作製する。この成形法としては、例えば金型プレス、冷間静水圧プレスまたはシート成形などを採用することができる。つづいて、前記成形体を窒素ガス気流中などの非酸化性雰囲気中や水蒸気を含む雰囲気中、アルゴンなどの不活性雰囲気中、空気中で加熱して前記バインダを除去した後、非酸化性雰囲気中、1400~1700℃、好ましくは1500~1650℃の温度で接結することに

よりAIN焼結体を製造する。

【0063】一方、前記常圧焼結に代えて前記原料をホットプレスや熱間静水圧プレス(HIP)焼結することによりAIN焼結体が製造される。

【0064】(6)回路基板の製造方法

まず、(a)窒化アルミニウム粉末と(b)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含む原料を有機バインダと共に有機溶剤中に分散してスラリーを調製する。つづいて、このスラリーをドクターブレード法により成形してグリーンシートを作製する。

【0065】前記(a)成分のA1N粉末は、前述した A1N焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様なも のが用いられる。

【0066】前記(b)、(c)の成分に用いられる化合物等は、前述したA1N焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様なものが用いられ、かつこれら(b)、

(c)成分の配合量を規定したのも前述したA1N焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様な理由によるものである。

【0067】前記(d)成分の焼結によりアルミナに変換されるアルミニウム化合物としては、例えば水酸化アルミニウム、フッ化アルミニウム、硝酸アルミニウム等を挙げることができる。

【0068】前記(d)成分の配合量を規定したのは、 前述したA1N焼結体の製造方法(5)で説明したのと 同様な理由によるものである。

【0069】また、(A)金属単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニウム粉末と(C) IIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種と(D) 硼素もしくは硼素化合物と(E) アルミナもしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを有機バインダと共に有機溶剤中に分散して導40体ベーストを調製する。

【0070】前記(A)成分の金属単体、導電性化合物としては、例えばタングステン、タングステン硼化物、タングステン炭化物、ケイ化タングステン、モリブデン、モリブデン硼化物、モリブデン炭化物、ケイ化モリブデン等を挙げることができる。これらの金属単体、導電性化合物は、後述する同時焼結工程で形成される導体層中に75~99重量%含有されるように配合することが好ましい。

した後、非酸化性寡囲気中、1400~1700℃、好 【0071】前記(B)成分のAlN粉末は、後述するましくは1500~1650℃の温度で焼結することに 50 同時焼結工程で形成される導体層中に1~20重量%含

有されるように配合することが好ましい。

【0072】前記(C)成分のIIa族元素化合物または IIa族元素化合物とIII a族元素化合物の両者は、後述 する同時焼結工程で形成される導体層中に0.001~ 3 重量%含有されるように配合することが好ましい。

【OO73】前記(D)成分の砌素もしくは硼素化合物 は、後述する同時焼結工程で形成される導体層中に酸化 物換算で0.001~3重量%含有されるように配合す ることが好ましい。

【0074】前記(E)成分のアルミナもしくは焼結時 にアルミナを生じるアルミニウム化合物は、後述する同 時焼結工程で形成される導体層中に酸化物換算で0.0 1~2重量%含有されるように配合することが好まし

【0075】次いで、前記グリーンシートの少なくとも 表面に前記導体ペーストをスクリーン印刷法等によりパ ターン状に塗布し、窒素やアルゴンの非酸化性雰囲気 中、水蒸気を含む窒素やアルゴン等の非酸化性雰囲気中 で加熱してバインダを除去した後、窒素等の非酸化性雰 囲気中、1400~1700℃、好ましくは1500~ 20 1650 Cの温度で焼結することにより回路基板を製造 する。

【0076】なお、多層回路基板は前述した回路基板の 製造方法(4)で説明したのと同様手順で製造される。 [0077]

【作用】本発明に係わるA 1 N焼結体(1)は、A 1 N を主成分とし、かつそれぞれ酸化物換算で所定量のIIa 族元素および IIIa 族元素から選ばれる少なくとも1種 の元素と硼素もしくは硼素化合物とマンガンもしくはマ ンガン化合物と含有するため、緻密で100W/m·K 以上の高い熱伝導率を有し、さらに優れたガラス封止性 を有する。

【0078】前記A1N焼結体(1)が優れたガラス封 止性を有する機構については、現在のところ明確ではな いが、発明者らの研究によれば以下のような組織になっ ていることに起因するものと考えられる。

【0079】すなわち、前記A1N焼結体に含有される 硼素もしくは硼素化合物とマンガンもしくはマンガン化 合物は、ランダムに分散して入る。主には、IIa族元素 -Al-O化合物または IIIa族元素-Al-O化合物 に均一に分散しており、微量はA1N中にも混入してい ると思われる。表面部分には、IIa族元素-Al-O化 合物または IIIa族元素-Al-O化合物とAlNの粒 子が存在しており、その両方に砌素元素とマンガン元素 が存在している。このような硱素元素とマンガン元素が 共存すると、ガラスが軟化温度以上の温度でAIN焼結 体表面に存在した時、ガラスの濡れ角を下げ、その結果 ガラスが薄く均一に濡れる。また、砌素とマンガンがA 1 N焼結体の表面に存在すると、ガラス封止に用いられ るガラス成分とミクロな結合が生成し、それらの間に接 50 れぞれ酸化物換算で所定量配合される(b)IIa族元素

合性および整合性の良好な界面を形成すると考えられ る。

【0080】本発明に係わるAIN焼結体の製造方法 (2) によれば、(a) AlN粉末と前記AlN粉末に 対してそれぞれ酸化物換算で所定量配合される(b)II a族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる 少なくとも1種の化合物と(c) 硼素もしくは硼素化合 物と(d)マンガンもしくはマンガン化合物とを含む原 料を焼結する。このような方法によれば、前記添加剤の 過剰な滲み出しを招くことなく、1700℃以下の低温 焼結により緻密化されて所望の熱伝導率を維持し、かつ ガラス封止が容易なAIN焼結体を製造できる。

【0081】すなわち、前記原料の焼結工程において前 記(c)硼素もしくは硼素化合物および(d)マンガン もしくはマンガン化合物の成分の相互作用により低温 (1700 C以下)で緻密化される。また、前記

(c)、(d)成分は前述したように焼結後のA1N焼 結体の表面において硼素とマンガンとしてガラス封止に 用いられるガラス成分とミクロな結合を生成し、それら の間に接合性および整合性の良好な界面を形成すること によりガラス封止性を向上できる。

【0082】本発明に係わる回路基板(3)は、A1N を主成分とし、かつIIa族元素およびIII a族元素から 選ばれる少なくとも1種の元素、硼素もしくは硼素化合 物およびマンガンもしくはマンガン化合物を含有する絶 縁層と、金属単体および/または導電性化合物、窒化ア ルミニウム、硼素もしくは硼素化合物およびマンガンも しくはマンガン化合物を含有し、かつIIa 族元素-A1 - O系化合物、III a族元素-Al-O系化合物および 30 IIa族元素-III a族元素-Al-O系化合物から選ば れる少なくとも1つの化合物を含有する導体層とを備え る。このような回路基板(3)によれば、前記導体層は 前記絶縁層と同材質の成分、特にマンガンが含有されて いるため、前記絶縁層と前記導体層とはマンガンを含む 複合酸化物により良好に密着される。また、前記導体層 には前記絶縁層と同材質の成分が含有されているため、 それら絶縁層および導体層間の熱膨張係数を整合させる ことができる。その結果、前記絶縁層と前記導体層間の 剥離等のない信頼性の高い回路基板を得ることができ

【0083】さらに、前記絶縁層は前述したA1N焼結 体(1)と同様な成分組成からなり、硼素元素とマンガ ン元素が共存してガラスが軟化温度以上の温度でその表 面に存在した時、ガラスの濡れ角を下げるため、良好な ガラス封止性を有する。したがって、かかる回路基板は キャップ等がガラス成分により接合されるパッケージ等 に有効に利用できる。

【0084】本発明に係わる回路基板の製造方法(4) は、(a)AIN粉末と前記AIN粉末粉末に対してそ

化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と(c)硼素もしくは硼素化合物と

(d) マンガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を 成形してグリーンシートを作製する工程と、(A)金属 単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニ ウム粉末と(C) IIa 族元素化合物およびIII a 族元素 化合物から選ばれる少なくとも1種と(D) 硼素もしく は硼素化合物(E)およびマンガンもしくはマンガン化 合物とを含む導体ペーストを調製する工程と、前記グリ ーンシートの少なくとも表面に前記導体ペーストをパタ ーン状に塗布した後、積層、脱バインダ、焼結を行う工 程とを備える。このような製造方法(4)によれば、1 700℃以下の低温同時焼結工程において前記絶縁層お よび前記導体層にマンガンを含む複合酸化物を形成でき るため、前記複合酸化物により前記絶縁層と前記導体層 とを良好に密着することができる。また、同時焼結工程 において絶縁層と導体層都の収縮率を整合させることが できる。その結果、前記絶縁層と前記導体層間の剥離等 のない信頼性の高い回路基板を製造することができる。

【0085】さらに、前記低温同時焼結工程において前 20 述したA1N焼結体の製造方法(2)で説明したのと同様な作用により緻密で高い熱伝導率を有すると共にガラス封止性が良好な絶縁層を形成できる。したがって、製造された回路基板はキャップ等がガラス成分により接合されるパッケージ等に有効に利用できる。

【0086】本発明に係わるAlN焼結体の製造方法 (5)は、(a)AlN粉末とこのAlN粉末に対して それぞれ酸化物換算で所定量配合される(b)IIa族元 素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化 合物の両者と(c)硼素もしくは硼素化合物および

(d)アルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物を含む原料を焼結する。このようなA1N焼結体の製造方法(5)によれば、アルミナの添加により酸素が供給されるため、A1N中に僅かに酸素が多く固溶し、A1サイトの格子欠陥を生成されてA1Nが自己拡散しやすくなり、低温で焼結される。また、硼素または硼素化合物を添加すると、一部粒界相がガラス化することにより、硼素が添加されない場合に比べて低温で流動化する粒界相成分が存在することになるため、微小なポアが残っても、その部分をガラス成分で埋める効果(リキッド・ポケット効果)により低温で緻密化することができる。その結果、100W/m・K以上の高い熱伝導率を有するA1N焼結体を製造できる。さらに、優れたガラス封止性を有するA1N焼結体を製造できる。

【0087】前記製造方法により得られたA1N焼結体が優れたガラス封止性を有する機構については、現在のところ明確ではないが、発明者らの研究によれば以下のような組織が形成されることに起因するものと考えられる。

16

【0088】前記A1N焼結体の原料として配合される 硼素や硼素化合物とアルミナは、焼結後において焼結体 中にランダムに分散して入る。主には、IIa 族元素-A 1-O化合物、III a族元素-Al-O化合物およびII a族素-III a族元素-Al-O化合物から選ばれる少 なくとも 1 つの化合物に均一に分散しており、微量はA IN中にも混入していると思われる。表面部分には、II a 族元素-Al-O化合物、III a 族元素-Al-O化 合物およびIIa族素-III a族元素-Al-O化合物か ら選ばれる少なくとも1つの化合物とA1Nの粒子が存 在しており、その両方にB元素とA1元素とO元素が存 在している。これらの元素が存在すると、ガラスが軟化 温度以上の温度でAIN焼結体表面に存在した時、ガラ スの濡れ角を下げ、その結果ガラスが薄く均一に濡れ る。また、硼素とマンガンがAlN焼結体の表面に存在 すると、ガラス封止に用いられるガラス成分とミクロな 結合が生成し、それらの間に接合性および整合性の良好 な界面を形成すると考えられる。

【0089】本発明に係わる回路基板の製造方法(6) は、(a)AIN粉末とこのAIN粉末に対してそれぞ れ酸化物換算で所定量配合される(b)IIa族元素化合 物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の 両者と(c)硼素もしくは硼素化合物と(d)アルミナ 粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化 合物とを含む原料を成形してグリーンシートを作製する 工程と、(A)金属単体および/または導電性化合物と (B) 窒化アルミニウム粉末と(C) IIa 族元素化合物 およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種 と(D)硼素もしくは硼素化合物と(E)アルミナもし くは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを 含む導体ペーストを調製する工程と、前記グリーンシー トの少なくとも表面に前記導体ペーストをパターン状に 塗布した後、焼結する工程とを備える。このような回路 基板の製造方法(6)によれば、1700℃以下の低温 同時焼結工程において導体層用原料は絶縁層用原料と同 様な成分(B)~(E)を含むため、それらに共通な複 合酸化物が生成されるととにより前記絶縁層と前記導体 層とを良好に密着することができる。また、同時焼結工 程において絶縁層と導体層都の収縮率を整合させること ができる。その結果、前記絶縁層と前記導体層間の剥離 等のない信頼性の高い回路基板を製造することができ る。

【0090】さらに、前記低温同時焼結工程において前述したA1N焼結体の製造方法(5)で説明したのと同様な作用により緻密で高い熱伝導率を有すると共にガラス封止性が良好な絶縁層を形成できる。したがって、製造された回路基板はキャップ等がガラス成分により接合されるバッケージ等に有効に利用できる。

[0091]

50 【実施例】以下、本発明を実施例に沿って、さらに詳細

に説明する。なお、これら実施例は、本発明を容易にす る目的で記載されるものであり、本発明を特に限定する ものではない。

【0092】(実施例1)不純物酸素量0.98重量 %、平均一次粒子径0.6μmのA1N粉95.5重量 %、平均粒径0.1 μm、純度99.9重量%のY, O , 3.0重量%、平均粒径3μmで純度99.9重量% のMnO, 0. 5重量%、平均粒径3 μmのB, O , 0.5 重量% および着色剤としてのWO, 0.5 重量 %からなる混合物にn-ブタノールを加え、湿式ボール 10 導率を測定したところ、160W/mKであった。 ミルにより解砕、混合した後、n-ブタノールを除去し て原料粉末を調製した。つづいて、この原料粉にアクリ ル系バインダーを5重量%添加して造粒した後、この造 粒粉を50MPaの一軸加圧下で成形して凹型の形状を した圧粉体とした。この圧粉体を窒素ガス雰囲気中、7 00℃で加熱してアクリル系パインダーを除去した。脱\*

<ガラスの組成> CoO MgO B, O, Bi, O, …1.50重量%。

【0096】封止した試料を、5気圧のヘリウムガスで 満たしたチャンバ中に40分放置した後、チャンバ内を 10<sup>-1</sup>torrオーダに真空に引いて、再び空気を1気 圧まで導入した。このヘリウム洗浄工程を3回行った した。このように処理した後、ヘリウムリーク試験(フ ァインリークの検知) にかけた。ヘリウムリーク量の検 出は、質量分析計で行った。その結果、1.0×10 -1° atm·cc·s-1以下であり、良好な値であっ た。さらに、3 M製フロリナート40番を120 ℃に暖 めた中に前記試料を入れて3分間放置するグロスリーク 試験を行った。その結果、気泡の発生はなく、グロスリ ークも確認されなかった。

【0097】(比較例1)実施例1と同様なA1N粉A IN粉96.5重量%、平均粒径0.1μm、純度9 9. 9重量%のY, O, 3. 0重量%および着色剤とし てのWO、0.5重量%からなる混合物にn-ブタノー ルを加え、湿式ボールミルにより解砕、混合した後、n - ブタノールを除去して原料粉末を調製した。つづい て、この原料粉末を用いて実施例1と同様な処理を施す 18

\* バインダー体をAIN焼結体から成る焼結容器中にセッ トし、グラファイト製ヒータ炉内にて1気圧の窒素ガス 雰囲気下、1700℃、6時間の焼結を行った。

【0093】得られたAlN焼結体は黒色で色ムラや焼 きムラがなく、また、清浄な表面であり、密度をアルキ メデス法で測定したところ3.30g/cm<sup>1</sup>と充分に 緻密化していた。前記AIN焼結体から直径10mm、 厚さ3mmの円板を切り出し、21±2℃の室温下で」 IS-R1611に従ってレーザーフラッシュ法で熱伝

【0094】また、前述した方法にしたがって2個の凹 型A1 N焼結体を製造した。得られた2個の凹型A1 N 焼結体をそれらの開口面が互いに当接するように重ねた 後、窒素雰囲気中で下記組成のガラスを用いてガラス封 止を行った。

[0095]

SiO, …6.60重量%、TiO, … 5.30重量% Al, O, …l. 80重量%、Fe, O, … 0. 08重量% Cr, O, …0.08重量%、PbO …57.7 重量% ··· 0. 02重量%、CaO ··· 1. 00重量% ··· 0. 03重量%、Na, O ··· 0. 01重量% …6.40重量%、ZnO …19.00重量% SnO, …0.01重量%、V,O, … 0.30重量%

ことによりAIN焼結体を製造した。

【0098】得られたAIN焼結体を実施例1と同様な 方法により密度および熱伝導率を測定した。その結果、 密度は3.30g/cm'と充分に緻密化しており、熱 後、試料をチャンバから取り出し、空気中で30分放置 30 伝導率は150W/m・Kであった。また、表面状態も 良好であった。しかしながら、実施例1と同様な方法で リーク試験を行ったところ、5. 0×10<sup>-7</sup>atm·c c · s<sup>-1</sup>とリーク量が大きかった。

> 【0099】(実施例2~27)下記表1、表3、表5 および表7に示すA1N粉、添加物を種々に変えた組成 の混合粉末を用い、下記表2、表4、表6および表8に 示す焼結条件にそれぞれ設定した以外、実施例1と同様 な方法により26種のA1N焼結体を製造した。得られ た各A1N焼結体の密度、熱伝導率、表面状態およびへ 40 リウムリーク結果を同表2、表4、表6および表8に併 記した。なお、表面状態が良好とは色ムラや焼きムラが なく、しかも目視で表面に何らの折出物が見られないと とを意味している。

[0100]

【表1】

表1

	AIN粒径	ⅡaまたはⅢaの	悉加剤	ほう業系	添加剤	Mn系統	加利	着 包	2 剤	その他添加	加利
Ì	(µm)	(wt%)		(w	t\$)	(wt)	()	(#	tX)	(wt%)	
実施例2	0. 1	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.	05)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(2.0)	MnO <sub>2</sub>	(3. 0)	wo <sub>3</sub>	(0. 5)	_	
実施例3	0.8	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (15.	. 0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(0. 05)	MnO2	(0. 05)	TIO2	(0. 5)	A 1 2 0 3 C2.	. 0)
実施例4	0.6	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.	5)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(0. 5)	MnO2	(0. 5)	wo <sub>3</sub>	(0. 5)	A 1 2 0 3 (0.	. 5)
実施例5	0.6	ру <sub>2</sub> О <sub>3</sub> (0.	5)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(1.0)	MnO2	(0, 4)	w	(0. 3)	A 1 2 O3 (0.	. 5)
実施例6	0.6	Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.)	0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(2.0)	MnO2	(0, 5)	ті02	(0. 4)	_	
実施例7	0. 07	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.1	0)	на воз	(1.0)	MnO <sub>2</sub>	(0. 5)	wo <sub>3</sub>	(0.5)	_	

注);各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表2】

表2

	<b>挽桔湿度</b>	時間	密 度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結果
	. (°C)	(hr)	(g/ca³)	(V/n · X)		(atm • cc • s -1)
実施例 2	1500	6	3. 28	125	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例3	1700	6	3. 39	160	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例 4	1680	12	3. 33	165	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例 5	1700	6	3. 33	160	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例 6	1700	6 .	3. 33	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例7	1400	24	3. 30	130	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

【表3】

表3

	AlN粒径	II aまたはIII aの添加剤	ほう素系添加剤	Mn系添加剂	着 色 剤	その他添加剤
	(µm)	(vt%)	(wt%)	(wt%)	(wt%)	(wt%)
実施例 8	0.3	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	MnO (0.5)	WO <sub>3</sub> (0.5)	<u>-</u>
実施例9	2.0	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.1). Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0) Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	M o O <sub>3</sub> (0.5)	A 1 2 03 (0.5)
実施例10	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (4.0)	B (0.5)	MnO <sub>2</sub> (0.2)	TaN (0.5)	
実施例11	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	B (0.2)	M n (0.5)	NbN (0.5)	_
実施例12	0. 6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (5.0)	B (1.0)	Mn (1.0)	TiO2 (0.5)	-
実施例13	0. 1	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.2)	Mn O <sub>2</sub> (3.0)	WO <sub>3</sub> (0.5)	_

注): 各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表4】

20

丧4

	焼桔湿度	時間	密度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結果
	(7)	(hr)	(g/cm³)	(V. n · 1)		(atn • cc • 8 <sup>-1</sup> )
実施例8	1550	12	3, 30	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例9	1800	6	3. 30	180	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例10	1700	4	3. 32	160	良 好.	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例11	1680	12	3. 30	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-1</sup> °
実施例12	1720	2	3. 33	165	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例13	1550	6	3. 26	125	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

【表5】

表5

	AIN粒径	IIaまたはIIIaの添加剤	ほう紫系添加剤	Mn系添加剤	着色 潮	その他添加剤
	(µm)	(ut%)	(vtX)	(wt%)	(vtX)	(wt%)
突施例14	0.8	C a O (0.5)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.05)	MnO <sub>2</sub> (0.05)	TiO2 (0.5)	A1203 (20)
実施例15	0.6	Ba <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	WO <sub>3</sub> (0.5)	A 1 2 03 (0.5)
実施例16	0. 6	Mg <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.2)	MnO <sub>2</sub> (0.4)	W (0.3)	A 1 2 03 (0.5)
実施例17	0, 6	CaC <sub>2</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	TiN (0.4)	_
実施例18	0. 07	CaO (1.0)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	WO <sub>3</sub> (0.5)	<del>-</del>
実施例19	0. 3	CaCO <sub>3</sub> (0.5), CaC <sub>2</sub> (0.5)	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (1.0)	M B O (0.5)	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例20	2.0	CaCO <sub>3</sub> (0.5), CaC <sub>2</sub> (0.3)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.5)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	M o O <sub>3</sub> (0.5)	A12 03 (0.5)
	 	CaO(0.1), BaCO <sub>3</sub> (0.1)				

注);各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表6】

表6

	旋桔湿度	時間	密 度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結果
	(°C)	(hr)	(g/cm³)	(V/a · 1)		(atm • cc • s -1)
実施例14	1720	6	3. 26	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例15	1670	12	3. 26	165	良.好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例16	1690	6	3. 26	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例17	1720	6	3. 26	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例18	1408	24	3. 28	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例19	1600	12	3. 26	130	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例20	1800	6	3. 25	180	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

【表7】

AIN粒径 DaまたはMaの添加剤 ほう素系添加剤 Mn系添加剂 その他添加剤 色 (wtX) (µm) (vtX) (xtx) (wt%) (wt%) CaCO (0.5)TaN (0.5) 実施例21 0.6 MnO, (0, 6) (0.2)CaCO, (L 0)実施例22 0.8 (0.2) $M \, n$ (0.5) NbN (0.5) CaCO, (2.0)B (1, 2)実施例23 Мп (1.0)TiO, (0.5) WВ MnO, 実施例24 0.6 (3.0)(2.8)Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0.5)wo, (0.3)CaCO, MnO, wo, A 1, O, (2.0) 実施例25 0.6 (1.0)TiB, (0.5) (1.0)(0.3)(0 E) 実施例26 0.5 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> LaB<sub>6</sub> (0.4) MnO (0.3)0.5 CaCO, (1. 0) Mη (0, 2) wo, 実施例27 CaB<sub>6</sub> (0.2) (D. 3) A 1, O, (2.0)

注) : 各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表8】

20

表8

	烧結温度	時間	密度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結果
	(°C)	(hr)	(E/CE3 )	(V/m · K)		(atm • cc • s <sup>-1</sup> )
実施例21	1720	4	3. 26	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例22	1700	12	3. 26	150	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例23	1700	2	3. 26	165	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例24	1650	6	3. 38	160	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例25	1600	6	3. 33	155	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例26	1650	6	3. 33	168	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例27	1600	6	3. 29	156	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

前記表2、表4、表6および表8から明らかなように実 施例2~27のAIN焼結体は、高密度で高い熱伝導率 を有すると共に、表面状態が良好で、さらに優れたガラ ス封止特性を有することがわかる。

【0101】(実施例28)不純物酸素量0.98重量 %、平均一次粒子径0.6μmのA1N粉95.5重量 %、平均粒径0. 1 µm、純度99. 9重量%のY, O , 3. 0重量%、平均粒径0. 3μmのMnO, 0. 5 重量%、平均粒径3μmのB、O、0.5重量%および 着色剤としてのWO, 0. 5重量%からなる混合物をボ ールミルを用いn-ブタノール中において湿式混合し た。この混合粉末を有機パインダーと共に有機溶剤中に 分散してスラリーを調製した。得られたスラリーをドク

ートを形成した。つづいて、とれらのグリーンシートの 所定位置に層間接続用の複数のビアホールを形成した。 【0102】一方、平均粒径0.4μmのW粉末85体 40 積%と平均粒径0.6のAlN粉末96重量%、Y,O , 3重量%、MnO, 0. 5重量%およびB, O, 0. 5重量%からなる混合粉末15.0体積%とを有機バイ ンダーと共に有機溶媒中に分散し、導体ペーストを調製 した。

【0103】次いで、前記導体ペーストを前記グリーン シートのピアホール内に充填すると共に表面にスクリー ン印刷し、導体ペースト層を形成した。つづいて、導体 ペースト層が形成された複数グリーンシートを、ピアホ ールで位置合わせして積層した後、加熱プレスを施し ターブレート法に従ってシート化し、複数のグリーンシ 50 た。つづいて、得られた積層体を水蒸気を含む窒素雰囲 気中、800℃で加熱して有機バインダを除去した。この脱バインダ体をN、等の非酸化性雰囲気中、1680℃、8時間同時焼結した。その結果、導体層間がピアホールで導通させた多層配線構造のセラミック回路基板が製造された。

【0104】得られたセラミック回路基板において、絶縁層は十分に緻密化しており、ポアは見られなかった。【0105】また、前記回路基板は反り、うねり、クラックやフクレがなく、表面が平滑であった。前記回路基板の形態をSEMで観察したところ、AINを主成分と 10 する絶縁層とWを主成分とする導体層とが共に充分緻密化していた。

【0106】さらに、前記絶縁層と同じ組成の2個の凹形A1N焼結体を実施例1と同様に製造した。得られた2個の凹型A1N焼結体をそれらの開口面が互いに当接するように重ねた後、窒素雰囲気中で下記組成のガラスを用いてガラス封止を行って試料を作製した。得られた試料について実施例1と同様なリーク試験を行った。その結果、1.0×10<sup>-10</sup> atm·cc·s<sup>-1</sup>以下であり良好な値であった。また、3M製フロリナート40番\*20

\*を120°Cに暖めた中に前記試料を入れ3分間放置する グロスリーク試験を行った。その結果、気泡を発生はな く、グロスリークも確認されなかった。

28

【0107】(実施例29~44)絶縁層用混合物として下記表9および表12に示す組成のものを用い、導体層用混合物として下記表10および表13に示す組成のものを用い、かつ同表10および表13に示す焼結条件に設定した以外、実施例28と同様な方法により16種の多層配線構造のセラミック回路基板を製造した。

【0108】得られた各セラミック回路基板の表面状態を調べた。また、前記各絶縁層と同じ組成の2個の凹形 A1N焼結体を実施例1と同様に製造した。得られた2個の凹型A1N焼結体をそれらの開口面が互いに当接するように重ねた後、窒素雰囲気中で下記組成のガラスを用いてガラス封止を行って試料を作製した。得られた試料について実施例1と同様なリーク試験を行った。さらに、各回路基板の導体層の抵抗率を調べた。これらの結果を下記表11および表14に示す。

[0109]

【表9】

表 9

		艳葙	量 周 用 混 合 4	<del></del>		
	AlN粒径	II aまたはIII aの添加剤	ほう業系添加剤	Mコ系添加剤	着色剤	その他添加剤
	(µm)	(wt%)	(vt%)	(vt%)	(wt%)	(¥t%)
実施例29	0. 2	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	MnO <sub>2</sub> (0.3)	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例30	0. 6	Yь <sub>2</sub> О <sub>3</sub> (3.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.08)	MnO <sub>2</sub> (1.0)	WO <sub>3</sub> (0.5)	A 1 2 0 3 (0.5)
実施例31	1. 0	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	MnO (0.5)	W (0.3)	A1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> (1.0)
<b>実施例32</b>	0. 4	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (5.0)	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (1.0)	Mn (0.5)	TiN (0.5)	_
実施例33	0.4	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	B (0.5)	MnO <sub>2</sub> (0, 2)	TaN (0.7)	_
<b>実施例34</b>	0. 4	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0), Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	N b N (0.7)	_
実施例35	0. 2	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	MnO <sub>2</sub> (3.0)	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例36	0. 6	C a O (1.2)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.08)	MnO <sub>2</sub> (1.0)	WO <sub>3</sub> (0.5)	A 1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> (1.5)

注) 各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表10】

表10

	綠	体 周 用 混 合 物		挽精系	<b>萨</b> 件
	<b>導体成分</b>	· 添加剤成分 • 組成	添加量	烧桔温度	時間
	(µm)		(vo1%)	(°C)	(hr)
実施例29	W(0.4), Ma(1.0)	A 1 N (0. 2 m) 97 wt% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3 wt%	35	1550	12
実施例30	W (0.6)	A 1 N (0.6 sm) 97 st % + Y b 2 O 3 3 st %	10	1680	12
実施例31	W (0.8)	A 1 N(1.0sm) 96wt% +Y2 O3 3wt%	20	1750	6
		+Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1wt%			
実施例32	М о (2.0)	A 1 N (0. 4 m) 95 wt% + Y 2 O 3 5 wt%	5	1850	6
実施例33	W (0.4)	A 1 N(0.42=) 98.6vtX +Y2 O3 1vtX	10	1600	12
	i	+B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.2vt%+MnO <sub>2</sub> 0.2vt%			İ
実施例34	W (0.4)	A 1 N (0. 4pm) 98wt% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1wt%	15	1630	· 12
		+Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> let%			
実施例35	W(0.4) , Mo(1.0)	Al N(0.2sm) 99wt% + CaCO3 1wt%	35	1550	12
実施例36	W (0.6)	AlN(0.6µm) 99wtx +CaO 1wtX	10	1680	12

### 注)各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

### 【表11】

	表面状態	ヘリウムリーク結果	導体層の抵抗率
		(atm - cc - s - t)	(×10 <sup>5</sup> Ωcs)
実施例29	良 纡	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 5
実施例30	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 2
実施例31	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例 3 2	良 好	≤1. 0×10 <sup>·10</sup>	1. 0
実施例33	良 好	≤1. 0×10 ·1°	1. 3
実施例34	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例:35	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 6
実施例36	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 3

【表12】

表12

		艳 録 層 用 觅 合 物								
	AlN粒径	IIaまたはIIaの添加剤	ほう素系鉱加剤	Mn系添加剤	着 色 剤	その他添加剤				
	(µm)	(vtX)	(wt%)	(*t%)	(wt%)	(wt%)				
実施例37	1. 0	CaC <sub>2</sub> (0.8)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	MnO (0.5)	W (0.3)	A 1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> (1.0)				
実施例38	0. 4	CaCO <sub>3</sub> (0.5). CaC <sub>2</sub> (0.5)	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (1.0)	M n (0.2)	TIN (0.5)	_				
実施例39	0. 4	CaCO <sub>3</sub> (0.8), BaCO <sub>3</sub> (0.5)	B (0.5)	MnO <sub>2</sub> (0.5)	TaN (0.7)	<u>-</u>				
実施例40	0.4	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	M n O <sub>2</sub> (0.5)	N b N (0.7)	-				
実施例41	0. 6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0)	WB (2.8)	M n O <sub>2</sub> (0.5)	WO3 (0.3)	-				
実施例42	0.6	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	TiB <sub>2</sub> (0.5)	MnO <sub>2</sub> (1.0)	WO3 (0.3)	A 1 2 0 3 (0.5)				
実施例43	0. 5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0)	LaB <sub>6</sub> (0.4)	MnO (0.5)	WO <sub>3</sub> (0.3)					
実施例44	0, 5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0)	CaB <sub>6</sub> (0.2)	M n (0.2)	WO3 (0.3)	A1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> (1.0)				

### 注)各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

# 【表13】

		導体層用混合物		烧箱乡	<b>存件</b>
	導体成分	添加剂成分 • 粗政	添加量	烧桔温度	時間
	(µm)		(vol%)	(°C)	(Jur.)
実施例37	W (0.8)	A 1 N(1.0m) 99.5wt% + C a C <sub>2</sub> 0.5wt%	20	1750	. 6
実施例38	M o (2.0)	A 1 N (0.4gm) 99wt% + C a C O 3 0.5wt%+ C a C 2 0.5wt%	15	1650	6
実施例39	W (0.4)	A 1 N (0.4m) 98.6 wt% + C a C O 2 0.8 wt%	10	1600	12
		+BaCO3 0.2wt%+Ba2 O3 0.2wt%+MnO2 0.2wt%			
実施例40	W (0.4)	A 1 N (0.4 m) 99 wt% + C a C O 3 1 wt%	15	1630	12
実施例41	W (0.6)	A 1 N (0.6µm) 97wt% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3.0wt%	10	1650	6
実施例42	W (0.4)	A 1 N (0.6 m) 97 ets + C a C O 1.0 ets	15	1650	8
		+T i B <sub>2</sub> 0.5wt%+MnO <sub>2</sub> 1wt%+A l <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5wt%			
実施例43	М о (0, 9)	A 1 N (0.5 pm) 97 vt x + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3, 0 vt x	25	1650	6
実施例44	M o (1.0)	AlN(0.5 pm) 97.6 wt% + CaCO 1.0 wt%	15	1650	12
		+ CaB <sub>6</sub> 0.2wt%+MnO <sub>2</sub> 0.2wt%+Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.0wt%			

### 注) 各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

# 【表14】

	表面状態	ヘリウムリーク結果	導体層の抵抗率
		(atm - cc - a -1)	(×10 <sup>-1</sup> Ωca)
実施例37	良好	≤1. 0×10 10	1. 5
実施例38	良 好	≤1. 0×10 ·1°	1. 1
実施例39	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 3
実施例40	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例41	良好	≤1. 0×10 <sup>-1n</sup>	1. 2
夹施例42	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例 4 3	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例44	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 3

前記表11および表14から明らかなように実施例29 ~44の回路基板は、表面状態が良好で、かつガラス成 分を封止材料として用いた時の封止特性に優れ、さらに 低抵抗の導体層を有することがわかる。

【0110】(実施例45)不純物酸素量0.98重量 %、平均一次粒子径0.6μmのA1N粉94.5重量 %、平均粒径0、1 μm、純度99、9重量%のY。O 20 , 3. 0重量%、平均粒径0. 2 μm、純度99. 9重 **重%のCaCO, 1.0重量%、平均粒径0.5μmで** 純度99.9重量%のAl, O, 0.5重量%、平均粒 径3 µmのB, O, 0.5 重量%および着色剤としての W〇、0、5重量%からなる混合物にn‐ブタノールを 加え、湿式ボールミルにより解砕、混合した後、n-ブ タノールを除去して原料粉末を調製した。つづいて、と の原料粉末にアクリル系バインダを5重量%添加して造 粒した後、この造粒粉を50MPaの一軸加圧下で成形 して凹型の形状をした圧粉体とした。この圧粉体を空気 30 雰囲気中、700℃で加熱してアクリル系パインダーを 除去した。脱パインダー体をAlN焼結体からなる焼結 容器中にセットし、グラファイト製ヒータ炉内にて1気 圧の窒素ガス雰囲気下、1550℃、6時間の焼結を行 ってAIN焼結体を製造した。

【0111】得られたAIN焼結体は、黒色で色ムラや焼きムラがなく、また清浄な表面を有していた。また、前記AIN焼結体の密度をアルキメデス法で測定したところ3.30g/cm³と充分に緻密化していた。前記AIN焼結体から直径10mm、厚さ3mmの円板を切 40り出し、21±2℃の室温下でJIS-R1611に従ってレーザーフラッシュ法で熱伝導率を測定したところ、160W/mKであった。

【0112】また、前述した方法にしたがって2個の凹実施例45と型AIN焼結体を製造した。得られた2個の凹型AIN 製造した。得 表面状態およ後、窒素雰囲気中で実施例1と同様な組成のガラスを用いてガラス封止を行った。封止した試料を、5気圧のへりウムガスで満たしたチャンバ中に40分放置した後、何らの析出物チャンバ内を10-1torrオーダに真空に引いて、再50【0116】

び空気を1気圧まで導入した。このヘリウム洗浄工程を3回行った後、試料をチャンバから取り出し、空気中で30分放置した。このように処理した後、ヘリウムリーク試験(ファインリークの検知)にかけた。ヘリウムリーク量の検出は、質量分析計で行った。その結果、1.0×10<sup>-1°</sup> atm·cc·s<sup>-1</sup>以下であり、良好な値であった。さらに、3M製フロリナート40番を120℃に暖めた中に前記試料を入れて3分間放置するグロスリーク試験を行った。その結果、気泡の発生はなく、グロスリークも確認されなかった。

【0113】(比較例2)実施例45と同様なA1N粉95.5重量%、平均粒径0.1μm、純度99.9重量%のY,O,3.0重量%、CaCO,を1.0重量%および着色剤としてのWO,0.5重量%からなる混合物にn-ブタノールを加え、湿式ボールミルにより解砕、混合した後、n-ブタノールを除去して原料粉末を調製した。つづいて、この原料粉末を用いて実施例45と同様な処理を施すことによりA1N焼結体を製造した

【0114】得られたA1N焼結体を実施例45と同様な方法により密度および熱伝導率を測定した。その結果、密度は3.28g/cm³と充分に緻密化しており、熱伝導率は130W/m・Kであった。また、表面状態も良好であった。しかしながら、実施例45と同様な方法によりリーク試験を行ったところ、6.0×10-7atm・cc・s-1とリーク量が大きかった。

【0115】(実施例46~71)表15、表17、表19 および表21に示すA1N粉、添加物を種々に変えた組成の混合粉末を用い、下記表16、表18、表20 および表22に示す焼結条件にそれぞれ設定した以外、実施例45と同様な方法により26種のA1N焼結体を製造した。得られた各A1N焼結体の密度、熱伝導率、表面状態およびヘリウムリーク結果を同表16、表18、表20 および表22に併記した。なお、表面状態が良好とは色ムラや焼きムラがなく、しかも目視で表面に何らの析出物が見られないことを意味している。

【表15】

表15. ..

	AIN粒径	II a または III a の 孫加利	ほう素系添加剤	Alg Og Ø	着 色 剤	その他添加剤
	(µm)	(wt%)	(wt%)	添加量(vtX)	(wt%)	(¥t%)
実施例46	0. 1	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.1), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	0.1	WO3 (0.5)	_
実施例47	0.8	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (13.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.05)	0.7	TIO2 (0.5)	
実施例48	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (5.0), CaCO <sub>3</sub> (6.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	0.5	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例49	0.6	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaO(1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	0.5	W (0.3)	_
実施例50	0. 6	Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	0.5	TiO2 (0.4)	_
実施例51	0. 07	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (L0)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	0.1	WO <sub>3</sub> (0.5)	S i (0.1)

注):各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表16】

表16

	旋粘温度	時間	密度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結
	(°C)	(hr)	(8/cm, )	(Y/m - E)		(atms • cc • s <sup>-1</sup>
実施例46	1500	12	3. 27	125	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例47	1550	12	3. 39	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例48	1600	8	3, 31	150	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例49	1620	6	3. 30	145	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例50	1630	6	3. 30	150	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例51	1400	24	3. 30	130	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

【表17】

表17

	AlN粒径 (µm)	II aまたはII aの添加剤 (wtx)	ほう素系添加剤 (wt%)	A 1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> の 添加量 (vt3)	1		
			ļ	MANAGEM (VICA)	(41.76)	(¥t%)	
実施例52	0. 3	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0) CaCO <sub>3</sub> (1.0)	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (1.0)	0.3	wo <sub>3</sub> (0.5)	SI <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	
		02003 (1.1)				(0. 2)	
実施例53	2.0	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.1), Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0),	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	20	M o O <sub>3</sub>	Si <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	
		Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0). CaCO <sub>3</sub> (1.0)		į	(0, 5)	(0. 2)	
実施例54	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (4.0), CaC <sub>2</sub> (1.0)	B (0.5)	0. 5	TaN (0.5)	Mn O <sub>2</sub> (0.5)	
実施例55	0. 6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0), CaO (1.0)	B (0.2)	0. 5	NbN (0.5)	MnO (0.5)	
実施例56	0.6	Y2 O3 (5.0), CaO(2.0)	B (0.1)	0. 5	T i O <sub>2</sub> (0.5)	M n (0.2)	
実施例57	0.1	CaCO <sub>3</sub> (L0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.2)	0. 1	WO <sub>3</sub> (0.5)	<del></del>	

### 注)各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表18】

20

表18

	烧結温度	時 間	密 度	密 度 熱伝導率 3		ヘリウムリーク結果
	ന	(hr)	(g/ca³)	(7/a - 1)		(atm • cc • s -1)
实施例52	1550	12	3. 29	140	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例53	1680	6	3. 30	160	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例54	1600	6	3. 32	145	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例55	1550	12	3. 29	135	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例56	1600	6	3. 33	150	良 好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例57	1600	12	3. 26	125	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

【表19】

表19

	AIN校径	IIaまたはIIaの抵加剤	ほう紫系添加剤	A12030	者 色 莉	その他添加剤
	(µm)	( <b>r</b> t%)	(rt%)	添加量(vt%)	(vt%)	(vt%)
実施例58	0.8	CaO (0.5)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.05)	0.3	T i O <sub>2</sub> (0.5)	-
実施例59	0.6	BaO (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	0.5	WO <sub>3</sub> (0.5)	-
実施例80	0.8	MgO (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	0.5	W (0.3)	-
実施例61	0.6	CaC <sub>2</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	0.5	T 1 N (0.4)	_
実施例62	0.07	C a O (1.0)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	0.1	WO <sub>3</sub> (0.5)	-
実施例63	0. 3	CaCO <sub>3</sub> (0.5), CaC <sub>2</sub> (0.5)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	0. 3	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例64	2. 0	CaCO <sub>3</sub> (0.5), CaC <sub>2</sub> (0.3)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.5)	1.5	M o O <sub>3</sub> (0.5)	-
		CaO(0.1). BaCO <sub>3</sub> (0.1)				

### 注):各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

【表20】

	烧結温度	時間	密 度	熱伝導率	表面状態	ヘリウムリーク結果
	(ප)	(hr)	(8/cm³)	(Y/n · Y)		(atm • cc • s -1)
実施例58	1650	6	3. 26	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例59	1700	12	3. 26	140	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例60	1700	12	3. 25	140	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例61	1650	6	3. 26	150	良好	≤1,0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例62	1450	30	3. 26	120	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例83	1600	12	3. 26	125	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例64	1700	24	3. 25	150	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

# 【表21】

表21

	AIN粒径	IIaまたはIIIaの添加剤	ほう素系	ほう素系添加剤		着 包	鱼 剤	その他	添加剤
	(µm)	(#t%)	(vt%)		添加量(vt%)	(wt%)		(wt%)	)
実施例65	0.6	CaCO <sub>3</sub> (0.5)	В	(0.6)	0.6	TaN	(0.5)	SI	(0.1)
実施例66	0.6	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	В	(0. 2)	0.7	иьи	(0.5)	SiO,	(0, 2)
実施例67	0. 6	CaCO <sub>3</sub> (20)	В	(L 2)	1.0	TiO,	(0.5)	SiaN	(0. 2)
実施例68	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). CaCO <sub>3</sub> (1.0)	WB	(2.8)	0. 5	wo <sub>3</sub>	(0.3)	_	-
実施例69	0.6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), Ca CO <sub>3</sub> (1.0)	TiB <sub>2</sub>	(0.5)	0.5	wo <sub>3</sub>	(0.3)	-	
実施例70	0, 5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). Ca CO <sub>3</sub> (1.0)	LaB <sub>6</sub>	(0.4)	C. 3	wo <sub>3</sub>	(0.3)	-	
実施例71	0.5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). Ca CO <sub>3</sub> (1.0)	CaB	(0. 2)	0.3	wo <sub>3</sub>	(0.3)	-	

#### 注) 各添加剤の括弧内の数値は、添加量を意味する。

#### 【表22】

表22

	瓷結溫度	時間	密度制品等率		表面状態	ヘリウムリーク結果
	<b>(°C)</b>	(hr)	(g/cm²)	(Y/m · K)		(atm • cc • s -1)
実施例65	1620	12	3. 26	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例66	1600	12	3. 26	130	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例67	1650	6	3. 26	135	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例68	1550	6	3. 38	140	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例69	1500	6	3. 33	145	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例70	1550	6	3. 33	148	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>
実施例71	1500	8	3. 29	146	良好	≤1.0 ×10 <sup>-10</sup>

前記表16、表18、表20および表22から明らかな ように実施例46~71のA1N焼結体は、髙密度で髙 い熱伝導率を有すると共に、表面状態が良好で、さらに 優れたガラス封止特性を有することがわかる。

【0117】(実施例72)不純物酸素量0.98重量 %、平均一次粒子径0.6μmのA1N粉94.5重量 %、平均粒径0.1μm、純度99.9重量%のY<sub>2</sub>0 , 3. 0重量%、平均粒径0. 3μmのCaCO, 1. O重量%、平均粒径3μmのB<sub>1</sub>O<sub>1</sub>O.5重量%、平 均粒径0. 4 µ m A 1, O, 0. 5 重量% および着色剤 としてのWO、0. 5からなる混合物を、ボールミルを 用いn-ブタノール中において湿式混合した。この混合 粉末を有機バインダーと共に有機溶剤中に分散してスラ リーを調製した。得られたスラリーをドクターブレード 法に従ってシート化し、複数のグリーンシートを形成し た。つづいて、これらのグリーンシートの所定位置に層 間接続用の複数のピアホールを形成した。

積%と平均粒径0.6μmのA1N粉末95重量%、Y , O, 3重量%、CaCO, 1重量%、B, O, 0. 5 重量%およびA1、〇、0.5重量%からなる混合粉末 15.0体積%とを、有機パインダーと共に有機溶媒中 に分散し、導体ペーストを調製した。

【0119】次いで、前記導体ペーストを前記グリーン シートのピアホール内に充填すると共に表面にスクリー 40 ン印刷し、導体ペースト層を形成した。つづいて、導体 ペースト層が形成された複数グリーンシートを、ピアホ ールで位置合わせして積層した後、加熱プレスを施し た。つづいて、得られた積層体を窒素雰囲気中、700 ℃で加熱して有機バインダを除去した。この脱パインダ 体をN, 等の非酸化性雰囲気中、1550℃、8時間同 時焼結した。その結果、導体層間がピアホールで導通さ せた多層配線構造のセラミック回路基板が製造された。 【0120】得られたセラミック回路基板において、絶 縁層は十分に緻密化しており、ポアは見られなかった。

【0118】一方、平均粒径0.4μmのW粉末85体 50 【0121】また、前記回路基板は反り、うねり、クラ

ックやフクレがなく、表面が平滑であった。前記回路基 板の形態をSEMで観察したところ、A1Nを主成分と する絶縁層とWを主成分とする導体層とが共に充分緻密 化していた。

【0122】さらに、前記絶縁層と同じ組成の2個の凹\*

\*形A1N焼結体を実施例45と同様に製造した。得られ た2個の凹型A 1 N焼結体をそれらの開口面が互いに当 接するように重ねた後、窒素雰囲気中で下記組成のガラ スを用いてガラス封止を行って試料を作製した。

[0123]

<ガラスの組成>

SiO, …6.60重量%、TiO, … 5.30重量% Al, O, …1.80重量%、Fe, O, … 0.08重量%

Cr, O, …O. 08重量%、PbO …57.7 重量%

CoO …0.02重量%、CaO … 1.00重量%

MgO …0.03重量%、Na,O … 0.01重量%

B, O, …6.40重量%、ZnO …19.00重量% SnO, …0.01重量%、V,O, … 0.30重量%

Bi, O, …1.50重量%。

【0124】得られた試料について実施例45と同様な リーク試験を行った。その結果、1.0×10<sup>-10</sup> a t  $m \cdot c \cdot c \cdot s^{-1}$ 以下であり良好な値であった。また、3 M製フロリナート40番を120℃に暖めた中に前記試 料を入れ3分間放置するグロスリーク試験を行った。そ かった。

【0125】(実施例73~88)絶縁層用混合物とし て下記表23および表26に示す組成のものを用い、導 体層用混合物として下記表24 および表27 に示す組成 のものを用い、かつ同表240および表27に示す焼結 条件に設定した以外、実施例45と同様な方法により1%

※6種の多層配線構造のセラミック回路基板を製造した。 【0126】得られた各セラミック回路基板の表面状態 を調べた。また、前記各絶縁層と同じ組成の2個の凹形 AIN焼結体を実施例1と同様に製造した。得られた2 個の凹型A 1 N焼結体をそれらの開口面が互いに当接す の結果、気泡を発生はなく、グロスリークも確認されな 20 るように重ねた後、窒素雰囲気中で下記組成のガラスを 用いてガラス封止を行って試料を作製した。得られた試 料について実施例45と同様なリーク試験を行った。さ らに、各回路基板の導体層の抵抗率を調べた。これらの

結果を下記表25および表28に示す。

[0127]

【表23】

表23

		抱 縁	層用混合	物		
	AlN粒径	IIaまたはIIaの添加剤	ほう紫系添加剤	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ø	着 色 剤	その他添加剤
	(mu)	(#t%)	(vt%)	近加量 (wt%)	(vt%)	(vtX)
实施例73	0. 2	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	0. 2	WO <sub>3</sub> (0.5)	_
実施例74	0.6	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0), CaO (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.08)	0. 5	WO <sub>3</sub> (0.5)	
実施例75	1. 0	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (5.0) CaCO <sub>3</sub> (L0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	1. 0	₩ (0.3)	-
実施例76	0.4	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (5.0) , CaCO <sub>3</sub> (0.5)	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (1.0)	0, 5	TIN (0.5)	SiO, (0.2)
実施例77	0.4	Y2 03 (5.0) . CaO(L0)	B (0.5)	0. 5	TaN (0.7)	Si, N, (0.2)
実施例78	0.4	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). CaCO <sub>3</sub> (0.8)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	0. 5	NbN (0.7)	MnO <sub>2</sub> (0.5)
実施例79	0, 2	CaCO <sub>3</sub> (1.0)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2.0)	0. 1	₩0 <sub>3</sub> (0.5)	<del>-</del>
実施例80	0.6	C a O(1.2)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.08)	0. 6	WO <sub>3</sub> (0.5)	_

注) ; 各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

		導 体 眉 用 湿 合 物		烧箱	条件
	導体成分	添加剂成分。组成	添加量	焼結湿度	時間
	(µm)		(vol%)	(%)	Ort)
実施例73	W(0.4). M o (1.0)	A I N (0. 2gm) 96. 0wt% + Y 2 O 3 3wt% + C a C O 3 1wt%	35	1500	10
爽施例74	W (0.6)	A I N (0.6sm) 97.0wtx + Y b 2 O 2 0 wtx + C a O 1.0wtx	10	1550	10
実施例75	W (0.8)	A 1 N (1.0gm) 95wt% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3wt%	20	1600	6
		+Yb2O3 lvt% +CaCO3 lvt%			
実施例76	M o (2, 0)	AlN(0.4sm) 96wtx + Y2 O3 2wtx + CaCO3 0.5 wtx	5	1600	6
ĺ		+H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> 1wt% +A 1 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5wt%			
実施例77	₩ (0.4)	A 1 N(0.4m) 94.8 tx +Y2 03 3 wtx + CaO 1 tx	10	1550	10
		+B0.5wt%+A12O30.5wt%+S13N40.2wt%			
実施例78	W (0.4)	A 1 N (0, 4sm) 95, 2st% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3wt%	15	1570	10
		+CaCO <sub>3</sub> 0.8 wt% +Ba <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1wt%			
実施例79	W(0.4). Mo(1.0)	A 1 N (0.2sa) 99wtx + CaCO 3 1wtx	35	1600	10
実施例80	W (0.6)	A 1 N (0.6 <sub>sm</sub> ) 98.8wt% + C a O 1.2wt%	10	1650	10

注);各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

### 【表25】

	表面状態	ヘリウムリーク結果	導体層の抵抗率
		(atm - cc - s -t)	(×10 <sup>-1</sup> Ωcm)
実施例73	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 6
実施例74	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 2
実施例75	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 5
実施例76	良 倂	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 1
実施例77	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 2
実施例 78	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 3
実施例79	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 5
実施例80	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4

【表26】

表26

		艳 昪	層 用 混 合	物		
	AlN校経	ⅡaまたはⅢaの酢加剤	ほう紫系添加剤	A12030	着 色 剤	その他添加剤
	(µm)	(wt%)	(vtX)	抵加量(wt%)	(vt%)	(wtX)
実施例81	1. 0	CaCO <sub>3</sub> (0.8), BaCO <sub>3</sub> (0.2)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.5)	2.0	W (0.3)	-
実施例82	0. 4	CaC <sub>2</sub> (0.8), MgCO <sub>3</sub> (0.2)	н <sub>3</sub> во <sub>3</sub> (1.0)	0. 5	TiN (0.5)	S i (0.2)
実施例83	0. 4	C a O (1. 0)	B (0.5)	0.4	TaN (0.7)	S i O <sub>2</sub> (0, 2)
実施例84	0. 4	CaCO3 (0.8). CaC2 (0.2)	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (1.0)	0.5	N b N (0.7)	Si 3 N 4 (0.2)
実施例85	0. 6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0). CaCO <sub>3</sub> (1.0)	WB (2.8)	0.5	WO <sub>3</sub> (0.3)	_
実施例86	0. 6	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	T 1 B <sub>2</sub> (0.5)	0.5	WO <sub>3</sub> (0.3)	-
実施例87	0. 5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	LaB <sub>6</sub> (0.4)	0.3	WO <sub>3</sub> (0.3)	-
実施例88	0. 5	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (3.0), CaCO <sub>3</sub> (1.0)	CaB (0.2)	0.3	WO <sub>3</sub> (0.3)	<del>-</del>

注):各添加物の括弧内の数値は、添加量を意味する。

# 【表27】

20

	1	烧秸条件			
	等体成分	<b>添加剤成分・組成</b>		挽結温度	時間
	(µm)		(vol%)	ന	(hr)
実施例81	W (0.8)	A i N(1.0µm) 96.5wtN + C a C O 3 0.8wtN	20	1700	6
		+ B a C O 3 0. 2 vt% + B a 2 O 3 0. 5 vt% + A I 2 O 3 2. 0 vt%			
実施例82	Mo(2.0)	A I N (0. 4gm) 97. 5wt% + C a C O 2 0. 8wt%	5	1650	6
		+MgCO3 0.2wtx+H3 BO3 1.0 wtx +A12 O3 0.5wtx			
実施例83	W (0.4)	A I N (0. 4pm) 99wt% + C a O 1. 0wt%	10	1670	10
実施例84	W (0.4)	A I N (0. 4 m) 97. 5 wt% + C a C O 3 0. 8 wt%	15	1630	12
		+ C a C <sub>2</sub> 0. 2 vtx + B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.0 vtx			
実施例85	W (0.6)	A 1 N(0. 6 m) 96. 5 wt% + Y 2 O 3 3. 0 wt% + C a C O 3 1. 0 wt%	10	1550	6
		+A1 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5wtX			
実施例86	W (0.4)	A 1 N (0. 6gm) 95wt% + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 3. 0wt% + C a C O <sub>3</sub> 1. 0wt%	15	1500	. 8
		+T i B <sub>2</sub> 0.5wtK+A l <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5wtK			
実施例87	W (0.9)	A 1 N(0. 5,m) 96wtx +Y2 O3 3.0wtx+CaCO3 1.0wtx	25	1550	6
実施例88	W (1.0)	A 1 N(0. 5/m) 95.5wt% +Y2 O3 3.0wt%+CaCO3 1.0wt%	15	1500	12
		+CaB <sub>6</sub> 0.2 vtX+A 1 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.3 vtX			

注);各版加物の括弧内の数値は、低加量を意味する。

【表28】

	表面状態	ヘリウムリーク結果	導体層の抵抗率
		(atm - cc - s ')	(×10 <sup>-1</sup> Ωcm)
実施例81	良 好	≤1. 0×10 '"	1. 4
実施例82	良 好	≤1. 0×10.10	1, 0
実施例83	良 好	≤1. 0×10 ·10	1. 3
実施例84	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 4
実施例85	良 好	≤1. 0×10 ·10	1. 2
実施例86	良 好	≤1. 0×10 ·10	1. 3
実施例87	良 好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 5
実施例88	良好	≤1. 0×10 <sup>-10</sup>	1. 3

前記表25 および表28から明らかなように実施例73 ~88の回路基板は、表面状態が良好で、かつガラス成 分を封止材料として用いた時の封止特性に優れ、さらに 低抵抗の導体層を有することがわかる。

#### [0128]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば緻 密で120W/mK以上の高い熱伝導率を有すると共に 20 前記絶縁層と導電材料を主成分とする導体層とが良好に ガラスを用いた封止特性の優れたAlN焼結体、および 1700℃以下の低温焼結により緻密で120W/mK 以上の高い熱伝導率を有し、かつ焼きムラ色や色ムラお\*

\*よび反りやうねりがなく、さらにガラスを用いた封止特 性の優れたAlN焼結体の製造方法を提供できる。

50

【0129】また、本発明によれば緻密で120W/m K以上の高い熱伝導率を有し、かつ焼きムラ色や色ムラ および反りやうねりがなく、さらにガラスを用いた封止 特性の優れたAINを主成分とする絶縁層を有し、かつ 密着した高信頼性の回路基板、およびかかる優れた特性 を有する回路基板を低温同時焼結により製造し得る方法 を提供できる。

#### フロントページの続き

(51)Int.Cl.		識別記号		庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 4 B	41/89	•	Z			
H05K	1/03	610	E	7511 – 4E		,
	1/09		Z	7726 – 4E		
	3/46		Н	6921-4E		

### (72)発明者 大石 克嘉

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

### (72)発明者 上野 文雄

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

### (72)発明者 加曽利 光男

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

### (72)発明者 角野 裕康

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第1区分 【発行日】平成13年12月11日(2001.12.11)

【公開番号】特開平8-81265

【公開日】平成8年3月26日(1996.3.26)

【年通号数】公開特許公報8-813

【出願番号】特願平6-221327

【国際特許分類第7版】

CO4B 35/581 41/87 41/88 41/89 H05K 1/03 610 1/09 3/46 (FI) CO4B 35/58 104 F 41/87 C 41/88 Q 41/89 Z HO5K 1/03 610 E 1/09 Ζ 3/46 CO4B 35/58 104 B

#### 【手続補正書】

【提出日】平成13年5月21日(2001.5.2 1)

#### 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

### 【特許請求の範囲】

a族元素およびIIIa族元素から選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物(B,O,)換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物(MnO,)換算で0.005~4重量%含有することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体。(請求項2) (a)窒化アルミニウム粉末と(b)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と(c)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(B,O,)換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(MnO,)換算で0.01~5重量%配合さ

【請求項1】 窒化アルミニウムを主成分とし、かつII

れるマンガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を焼結することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体の製造方法。

【請求項3】 焼成窒化アルミニウム組成物から構成され、この組成物が窒化アルミニウムを主成分とし、さら にIIa族元素およびIII a族元素から選ばれる少なくと も1種の第1添加物、硼素もしくは硼素化合物の第2添 加物およびマンガンもしくはマンガン化合物の第3添加 物を含有する絶縁層と、

主要成分として電気導電性を示す金属または電気的導電性化合物を含む導電成分を有し、さらに窒化アルミニウムおよび前記第1から第3の添加物を含有する導体層とを具備したことを特徴とする回路基板。

【請求項4】 窒化アルミニウムを主成分とし、かつII a 族元素およびIII a 族元素から選ばれる少なくとも1種の元素を酸化物換算で0.05~15重量%含有し、さらに硼素もしくは硼素化合物を酸化物(B,O,)換算で0.01~4重量%、マンガンもしくはマンガン化合物を酸化物(MnO,)換算で0.005~4重量%含有する絶縁層と、

少なくとも一部が金属単体および/または導電性化合物、窒化アルミニウム、硼素もしくは硼素化合物およびマンガンもしくはマンガン化合物を含有し、かつIIa族

元素-Al-O系化合物、III a族元素-Al-O系化合物およびIIa族元素-III a族元素-Al-O系化合物から選ばれる少なくとも一つの化合物を含有する導体層とを具備したことを特徴とする回路基板。

【請求項5】 (a)窒化アルミニウム粉末と(b)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物と

(c)前記室化アルミニウム粉末に対して酸化物(B,O,)換算で $0.01\sim5$ 重量%配合される硼素もしくは硼素化合物と(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物(MnO,)換算で $0.01\sim5$ 重量%配合されるマンガンもしくはマンガン化合物とを含む原料を成形してグリーンシートを作製する工程と、

(A)金属単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニウム粉末と(C)IIa族元素化合物およびII a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種と(D)硼素もしくは硼素化合物(E).およびマンガンもしくはマンガン化合物とを含む導体ベーストを調製する工程と、

前記グリーンシートの少なくとも表面に前記導体ベーストをパターン状に塗布した後、積層、脱バインダ、焼結を行う工程とを具備したことを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項6】 (a) 窒化アルミニウム粉末と(b) 前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c)前

記室化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される硼素もしくは硼素化合物および(d)前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物を含む原料を焼結することを特徴とする窒化アルミニウム焼結体の製造方法。

【請求項7】 (a) 窒化アルミニウム粉末と(b) 前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.05~15重量%配合されるIIa族元素化合物またはIIa族元素化合物およびIII a族元素化合物の両者と(c) 前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合される研索もしくは硼素化合物と(d) 前記窒化アルミニウム粉末に対して酸化物換算で0.01~5重量%配合されるアルミナ粉末もしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含む原料を成形してグリーンシートを作製する工程と、

(A)金属単体および/または導電性化合物と(B)窒化アルミニウム粉末と(C) IIa族元素化合物およびII I a族元素化合物から選ばれる少なくとも1種と(D) 硼素もしくは硼素化合物と(E)アルミナもしくは焼結時にアルミナを生じるアルミニウム化合物とを含む導体ペーストを調製する工程と、

前記グリーンシートの少なくとも表面に前記導体ペーストをパターン状に塗布した後、積層、脱パインダ、焼結を行う工程とを具備したことを特徴とする回路基板の製造方法。